Hunge int

PAT-NO:

JP362065477A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 62065477 A

TITLE:

ORGANIC THIN FILM RECTIFYING DEVICE

PUBN-DATE:

March 24, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MOTOMA, NOBUHIRO MIZUSHIMA, KOICHI AZUMA, MINORU

MIURA, AKIRA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP60205726.

APPL-DATE:

September 18, 1985

INT-CL (IPC): H01L029/91, H01L049/02

US-CL-CURRENT: 257/E51.048

ABSTRACT:

PURPOSE: To facilitate extremely high speed switching operation by a method wherein an organic thin film in a junction structure of metal/organic thin film/ metal is composed of a laminated structure of thin films containing donor type organic molecules and thin films containing acceptor type organic molecules to provide rectifying characteristics.

CONSTITUTION: 10 layers of LB films 2 made of tetrathiafulevalene (TTF) as a

donor type molecule are formed on an Al substrate 1 and 10 layers of LB films 3 made of tetracyanoquinodimethane (TCNQ) as an acceptor type molecule are formed on the films 2. An Al electrode 4 is formed on the films 3 by evaporation. When a bias is zero, the ionizing potential IPD of the LB film 2 containing donor type molecules is small and the electron affinity EA of the LB film 3 containing acceptor type molecules is large and difference between those two values is, for instance, less than about leV. When a forward bias is applied, electron transition from the electron conditions of the LB film 2 to the electron conditions of the LB film 3 is induced and a forward current is applied. When a reverse bias is applied, potential barrier between the electron conditions of the LB film 3 and the electron conditions of the LB film 2 is high so that no electron transition is induced and hence no current is applied.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

四公開特許公報(A) 昭62-65477

MInt Cl.

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)3月24日

H 01 L 29/91 49/02 7638-5F 6466-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

有機薄膜整流素子 49発明の名称

> 願 昭60-205726 の特

昭60(1985)9月18日 田田

間 伊発 明 者 源

弘 信 公

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

<u>B</u> 明 者 水 伊発 東 ⑦発 明 者

川崎市幸区小向東芝町 1 香地 株式会社東芝総合研究所内 実

明 Ξ 母発 明 者 株式会社東芝 頣 人 の出

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 鈴江 武彦 の代理

外2名

1、発明の名称

有限潛鏡籍改業子

- 2. 特許請求の範囲
- 金属/有機掃膜/金属の接合構造を有し、 有機弾膜をドナー性有限分子を含む弾膜とアクセ プタ性有限分子を含む砷酸の磺醛磷造としたこと を特徴とする有機薄膜整視素子。
- ドナー性有機分子を含む薄膜とアクセブ 9性有限分子を含む頑護の間に絶縁性有限分子が らなる薄膜を介在させた特許請求の範囲第1項記 収の有機薄製整炭素子。
- (3) 有機保護はラングミュア・プロジェット 法により形成される特許請求の範囲第 1 項記載の 有进词被整弦景子。
- 3. 発明の詳細な説明
- (発明の技術分野)

本発明は有機嫌護を用いた金属/有機研膜/金 温雄治の整法素子に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

近年、ラングミュア・プロジェット法(以下、 LB法)に代表される有機分子の超碲摄形成技術 の進展により、有機弾膜を用いた素子の検討が話 発化している。ダーラム(Duhrass)大学のロバ ーツ (G. G. Roberts) の、有機薄膜を絶機膜 として用いたMIS素子の研究を代表として、こ の種の研究が各研究機関で行われている。有機材 料中では一般に、無機半導体と比較して電子移動 度が小さいため、これまで超高速素子への応用側 は発表されていない。

無根半導体材料を用いた素子においても、サブ p sec の動作速度を有する非線形素子の提案は、 分子差エピタキシー法(MBE法)で形成した GaAs-AIGaAsヘテロ接合を用いた超格 子素子等に僅かに見られるに過ぎない。しかしこ の様な無機半導体を用いた超格子素子は、極めて 高偏な製鉄装置と遊告な制御を必要とする。また 高速化のためには、各層の浮みを数10人といっ た薄いものにすることが必要である。この様な薄 い無臓半導体弾膜を用いた素子では、ヘテロ接合 界面の結晶性劣化のために再現性が悪く、また制 的に極めて不安定なものとなり、耐久性に乏しい。 (発明の目的)

本発明は上記した点に鑑みなされたもので、有機分子の弾簧を用いて超高速のスイッチング動作、を可能とした有機弾鉄整旋素子を提供することを目的とする。

(発射の展要)

本見明は、金属/有機知識/金属の接合構造を用い、その有機理験を、ドナー性有機分子即ちイオン化ポテンシャル(IP)が小さく他の分子に電子を供給して自らはプラスのイオン状態になり易い分子を含む薄膜と、アクセプタ性有機分子を受取り自らはマイナスのイオン状態になり易い分子を含む薄膜の機器構造として、整備特性を実現したものである。

有機分子の特徴として、分子設計と化学合成に より、そのイオン化ポテンシャル(『P)と電子 観和力(E)の値を任意に制御できること、更に

遠い整流素子が得られる。しかも、無機半導体の 超格子構造を形成する場合に比べると、製鉄が容 易であり、接合界面の結晶性劣化という関面もないため、幾的安定性に優れ、価格の点でも有利に なる。従って本発明の整流素子は、各種論理素子 や記憶素子等への応用が明神される。

(発明の実施房)

以下本発明の実施例を説明する。

A & 基板上に、ドナー性分子としてテトラチアフルパレン(TTF)を用いたしB膜を10番形成し、更にその上にアクセプタ分子としてテトラシアノキノジメタン(TCNQ)を用いたしB膜を10層形成した。そしてこの上にA & 電極を厳替法により形成した。

第1回はこのようにして形成された整体素子を示す。1がAR基板、2がドナー性分子を含む LB根、3はアクセプタ性分子を含むLB膜、4 はAR電板である。

第2回はこの整度来子の動作を説明するための パンド因である。(a)は零パイアス時であり、 これらの値が広範囲にわたっていること、が挙げられる。これは、無機材料にはない有機材料に特有のものである。しかも、LB法に代表される有機課題の形成技術の進歩により、多種多様の分子の単分子膜や超導膜が均一かつ欠陥のない状態で形成できる。

せって本発明では好ましくは、有機解説はLB 法により形成される単分子膜あるいは単分子膜を 数層重ねた超解膜を用いる。有機物質中を動く電 子または正孔は一般に無機半導体中より違度が いが、数人~数10人といった超薄膜を用いるこ とにより、十分高速度の電荷移動が可能であり、 また実際にしB法によりその様な調形成が可能で あるからであ

また有機分子は閉殻構造をしているため、金良との非面に形成される非面単位の数は比較的少ない。

(発明の効果)

本発明によれば、十分に薄い2種の有機薄膜を 金属の間に挟むという簡単な構成で、応谷速度の

第3回はこの実施例の整流素子について測定した電流一電圧特性である。因示のように登逸特性、即ちダイオード特性を示す。

またこの実施例の整塊素子の周波数応答特性を 制定したところ、500G比まで応答することが 確認され、高速スイッチング動作が可能であるこ とが明らかになった。

本実施例の整度業子での整備特性のメカニズム

潭

と高速応答特性の理由を少し詳しく説明すると、 以下の通りである。 パイアス 零の状態でドナー性 分子を含む L B 膜 2 の電子状態を占有していた電 子は、パイアス電圧が、

【(lpp-EA)ーe² /a)/e 【V】
を超えると、アクセプタ性分子を含むし、B膜3の電子状態へと選びする。lppが小支護が、EA合ーをで、のが、では、その差が1eVである。ーe² /aに生ののでは、テクセプタ性分子を含むし、B膜2のイナンとでは分子を含むし、というではない。

一方、上述の電子選移は、選移に関連する各々の電子状態機の選移行列要素Hifの大きさによって支配され、選移に要する時間はその選移行列要素Hifは、 業Hifの逆数に比例する。選移行列要素Hifは、 ドナー性分子、アクセプタ性分子の種類、その関 の距離および位置関係によって決まるが、四分子を適当に選ぶことにより、1meV~1eVの範囲のものを設定することが可能である。従ってスイッチング時間が1psec~10⁻³psecと極めて高速のスイッチング動作が可能となるのである。

本 発明は上記した 実施 例に 扱られるものでは ない。 例えばドナー性分子は上記 実施 例のTTFの他に、以下のようなものを用い 得る。

 $\begin{array}{c} \texttt{J} \times \texttt{F} \mathsf{N} + \texttt{F} + \texttt{F}$

ノリニウムヨーダイド (N M Q) 、 アクリジン (A d) 、 n - メチルフェナジニウム メチルスルフェイト (N M P) 、 1 . 2 - ジ (n - エチル - 4 - ピリジウム) エチル ヨーダイド ((D E P E) ^{2 *} 1 ^{2 *}) 。

またアクセプタ性分子としても上記実施例の TCNQの他に以下のようなものを用い得る。

2-メチル-7.7.8.8-テトラシアノキ ノジメタン(MTCNQ)、2.5-ジメチル-7.7.8.8-テトラシアノキノジメタン(D MTCNQ)、2.5-ジエチル-7.7.8. 8-テトラシアノキジメタン(DETCNQ)、 2-メトキシ-7.7.8.8-テトラシアノキ ノジメタン(MOTCNQ)、2.5-ジメトキ シ-7.7.8.8-テトラシアノキノジメタン (DMOTCNQ)、2-メトキシ-5-エトキ シ-7.7.8.8-テトラシアノキノジメタン (MOEOTCNQ)、2-メトキシジにドロジ オキサベンゾ-7.7.8.8-テトラシアノキノジメタン イジメタン(MODOTCNQ)、2-クロロー 7. 7. 8. 8 - テトラシアノキノツメタン(C TCNQ)、2-プロモー7.7.8.8-デト ラシアノキノヴメタン(BTCNQ)、2. 5 -ジプロモー7.7.8.8-テトラシアノキノジ メタン (D B T C N Q) 、 2 . 5 - ジョード - 7 . CNQ), 2-200-5-xfn-7.7.8. 8 - テトラシアノキノヴメタン(CMTCNQ)、 2 - プロモー 5 - メチルー 7 . 7 . 8 . 8 - テト ラシアノキノジメタン(BMTCNQ)、2-3 - ド - 5 - メチル - 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシア ノキノジメタン(IMTCNQ)、11, 11, 12, 12-テトラシアノ-2.6-ナフトキノグメタン (TNAP), 1, 1, 2, 3, 4, 4-5+4 シアノアタジエン(HCB)、ナトリウム 13. 13. 14. 14-テトラシアノクフェノキノグメタン (NaTCDQ)、テトラシアノエチレン(TC NE)、0-ペンソキノン、p-ペンソキノン 2.6-ナフトキノン、グフェノキノン、テ シアノジキノン(TCNDQ)、ローフル

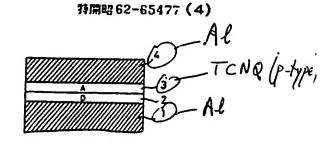
また上記支施例ではドナー性分子圏とアクセプタ性分子圏のみの張編構造により整定特性を得るようにしたが、これらの間に絶縁性の有限分子を用いた困難膜を介在させてもよい。

4. 図面の簡単な説明

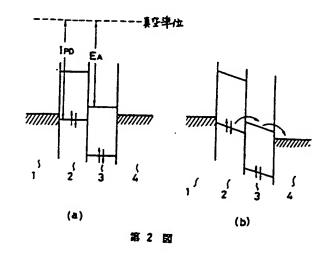
第1回は本発明の一実施例の有機即膜整度素子を示す因、第2回(a)(b)はその整度特性を説明するためのパンド図、第3回は同じく持られた整度特性を示す因である。

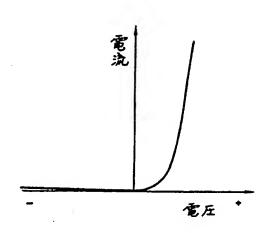
1 … A & 基板、 2 … ドナー性分子を含む L B 膜、 3 … アクセプタ性分子を含む L B 膜、 4 … A & 電極。

出票人代理人 弁.型士 鈴工武彦



第1図





第 3 図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

M BLACK BORDERS
M IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☑ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.